2025、10、07〈半導體電漿電源的演進應用與設計關鍵〉

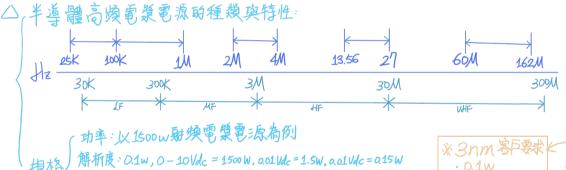
—— 呈睿國際股份有限公司 · 總經理暨創辦人 汉再和博士

△從2023年起半導體設備產值超過100Billion 絕大部份在先進製程(晶元製造)

△前五大設備商(AUAT、ASML、TEL、Jam. KLA) 笃為電漿製程設備→高拱街高碟

△ 雷獎 電源: 電源領域最特殊之應用一非線性負載、射頻、真空

INDUSTRIAL SEMICONDUCTOR DATA CENTER TELECOM & & MEDICAL EQUIPMENT COMPUTING METWORKING



△半專體蝕刻電獎系統:控制方法×犬F頻率混和×負載特性

精準度: ±1% f set point or ± 0.25W, whichever is greater

重現性: ±0.5% for same generator, ±1.0% generator to generator

「Cex control:同頻率不同相位解釋推穩電樂 Luling Control 高頻弦波下的方波開闢導通控制

~~~ 同一台電源測試第一次第二次第三次的談差值

△現行高頻電裝電源三大瓶頸{1.電力品質: 譜波失真率最低卡在30%(因為单一機台供電給對戶電線電源) 2.效率→,耐元件電裝電源轉換效率:18有30%的提升潛力

> 效率=輸出/輸入=5000W/1700W=29.4% 損失=輸入/輸出=1700W-5000W=1200W(熱損失)

>廠務供電(1700W)=損失(1200W)+輸出(5000W)

5和真空管的電視電源效率低於30%. 駁動就耗電,12加

· 0.1W

.0.1%

Made with Goodnotes

△轉換效率問題:30%的改善空間 (各負載狀況下整機效率: 歐製>美製四代>美製二代> 陸製 > 美製一代

、電力品質問題:30%是現行電流諧波天花板 

△電壓壓降問題: SEMI F47 Valtage Sag 規範遠遠不足應付現實

与若未降到,50%以下,需維持在0.2秒(ex. 208V→104V) 30%以下,需維持在0.5秒

20%以下、需維持在1秒 △電源敬熱問題:熱果積導致故障及重大工安隱憂

美製5第一代(20~90-150℃)。 熱累積導致元件故障→壽命、縮減

△ 老舊的功率量測技術: 泉率的隱形殺于
電路耦合量測技術  $\rightarrow$  VSWR (極級比) > + 就失真  $\Rightarrow$  (Pforward =  $(V_F)^2/50\Omega$ 

△新舊電源模組的性能比較{1.壓降改善>500%(不超過50%都不會跳掉) 2.效率提升15-5% 3. 醬波改善90% 4.符合安規(舊版管不符合)